

# ・ 走査電子顕微鏡

日立製作所 S-3000N



部位	型式	諸元
S-3000N 本体	分解能  倍率  加速電圧 イメージソフト 像の種類  画像メモリ 自動化機能 真空到達度 低真空モード	高真空モード <sup>*</sup> ; 2次電子像 3.5 nm 低真空モード <sup>*</sup> ; 反射電子像 5.0 nm  ×15～×300,000(65段) 加速電圧、WD、スキャンスピード <sup>*</sup> によって異なる  0.3～30kV ±20 μm以上(WD=15mm) 高真空モード <sup>*</sup> 時のみ 2次電子像 反射電子像(4分割形半導体:組成・凹凸・立体)  標準・高精細・積算 ABC,AFC,ASF,フルオートモード <sup>*</sup> 1.5 × 10 <sup>-3</sup> Pa 1～270 Pa(25段)
標準ステージ	可動範囲      試料サイズ <sup>*</sup> 試料交換	X; 0～80 mm Y; 0～40 mm Z; 10～35 (15mm試料台) 10～25 (60、125試料台) T(ニセントリック傾斜); -20° ～ 90° R(回転); 360° 最大 150mm(径) エア-導入方式
15 mm試料台		
60mm(3インチ)試料台		
大口径(125mm)試料台		